

DF30PC3M

30V 30A

特長

- SMD
- 超低 $V_F=0.4V$
- 小型大電流容量

用途

- バッテリー逆接防止
- DC出力OR用
- DC/DCコンバータ
- 携帯電話、パソコン

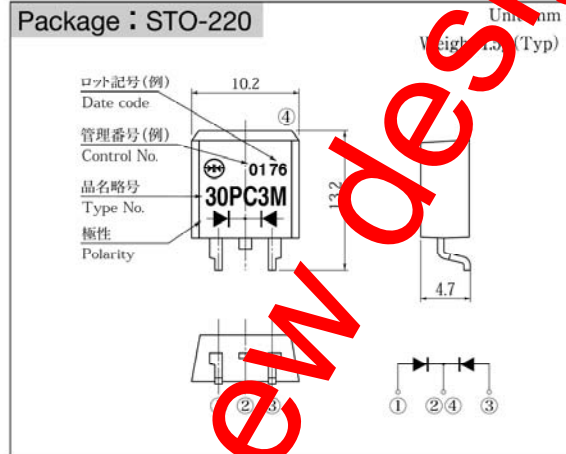
Feature

- SMD
- Ultra-Low $V_F=0.4V$
- High Io Rating・Small-PKG

Main Use

- Reverse connect protection for DC power source
- DC OR-output
- DC/DC Converter
- Mobile phone, PC

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元ホームページ又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

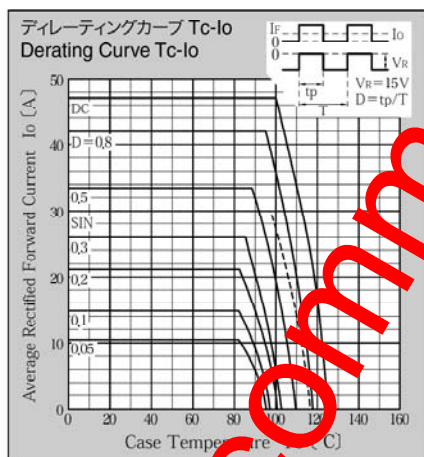
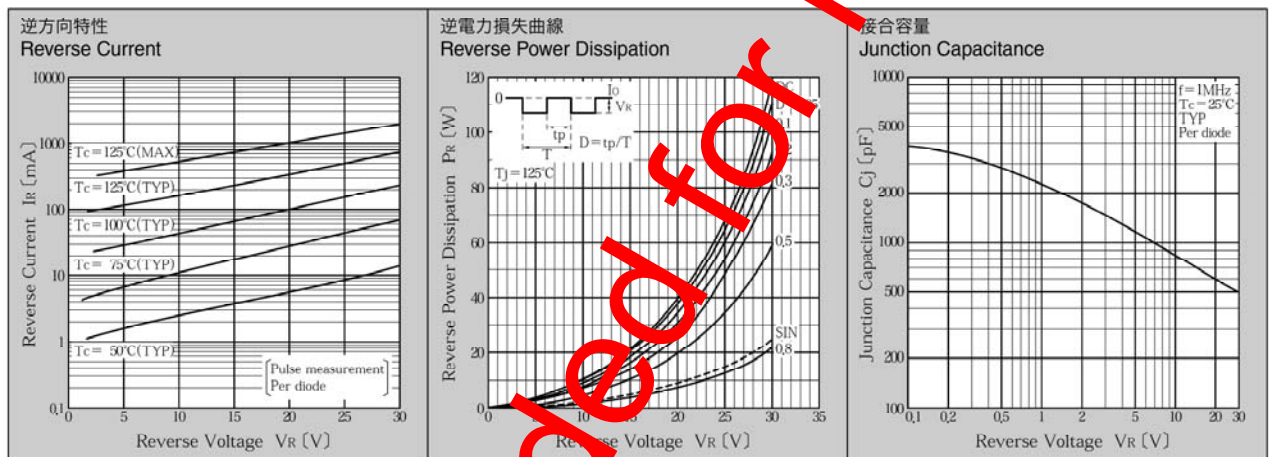
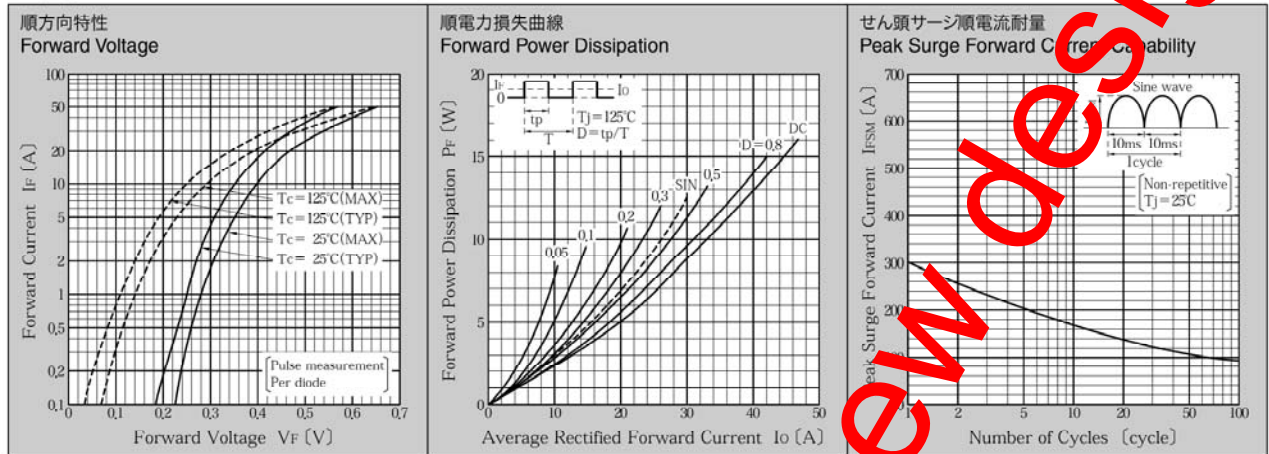
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_C = 25^\circ C$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF30PC3M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~125	$^\circ C$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			125	$^\circ C$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			30	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		35	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値/2, $T_C = 97^\circ C$ 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode $I_o/2$, $T_C = 97^\circ C$		30	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ C$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ C$		300	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_C = 25^\circ C$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 10A$ パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.40	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = 10V$ パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 50	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1MHz, V_R = 10V$, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 840	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 1.6	$^\circ C/W$

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 * Typical is a statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 * Typical is a statistical average of the device's ability.

Not recommended for new design